Pieczęć Katedry

SPRAWOZDANIE Z PLANU OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNEGO W ROKU 2010 / 2011

STUDIA STACJONARNE

Lp	Przedmiot wg programu studiów	Wydział	Rok	Ilość studentów na roku	Ilość grup (wykł. ćwicz lab)	Liczebność grupy	Semestr zimowy			Semestr letni			RAZEM godz. w ciągu roku	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe																													
	WYKŁADY						Wymiar tygodniowy	Ilość tygodni	Ogółem godzin	Wymiar tygodniowy	Ilość tygodni	Ogółem godzin		Bień Andrzej profesor	Gajda Janusz profesor	Gryboś Paweł profesor	Sidor Tadeusz profesor	Szyper Michał profesor	Borkowski Dariusz adiunkt	Burnos Piotr adiunkt	Duda Krzysztof adiunkt	Gawędzki Wacław adiunkt	Maj Piotr adiunkt	Nabielec Jerzy adiunkt	Nalepa Jacek adiunkt	Piwowar Piotr adiunkt	Skalski Andrzej adiunkt	Sroka Ryszard adiunkt	Stencel Marek adiunkt	Szczygieł Robert adiunkt	Turcza Paweł adiunkt	Wetula Andrzej adiunkt	Zatorski Andrzej adiunkt	Żegleń Tadeusz adiunkt	Żołądź Mirosław adiunkt	Kachel Maciej asystent	Kasiński Krzysztof asystent	Kmon Piotr asystent	Marszałek Zbigniew asyst.	Socha Mirosław asystent	Jurkiewicz Jerzy st. wykł.	Zalas Jacek st. wykład.	
1	Metrologia	EAIiE	1K	222	1	222	-	-	-	2	15	30	30																				30										
2	Metrologia I	EAIiE	2E	168	2	84	2	15	60	-	-	-	60	60																													
3	Metrologia II	EAIiE	2E	156	1	156	-	-	-	2	15	30	30	30E																													
4	Metrology	EAIiE	1M	24	1	24	-	-	-	2	15	30	30				30																										
5	Metrologia i systemy pomiarowe	EAIiE	2A	60	1	60	2	15	30	-	-	-	30															30E															
6	Pomiary w energetyce	EAIiE	3EA	50	1	50	2	15	30	-	-	-	30	30																													
7	Teoria i przetwarzanie sygnałów	EAIiE	3EB	30	1	30	2	15	30	-	-	-	30																		30												
8	Elektroniczne układy pomiarowe	EAIiE	3EC	48	1	48	-	-	-	2	15	30	30				30																										
9	Metody identyfikacji systemów	EAIiE	3EC	48	1	48	-	-	-	2	15	30	30		30																												
10	Miernictwo przemysłowe	EAIiE	3EC	48	1	48	-	-	-	2	15	30	30									30E																					
11	Systemy pomiarowe	EAIiE	3EC	48	1	48	2	15	30	-	-	-	30															30E															
12	Teoria i przetwarzanie sygnałów	EAIiE	3EC	48	1	48	2	15	30	-	-	-	30								30E																						
13	Komputerowe systemy pomiarowe	EAIiE	3N	120	1	120	2	15	30	-	-	-	30									30																					
14	Systemy pomiarowe	EAIiE	3R	120	1	120	-	-	-	2	15	30	30																30														
15	Programow mikrokontr w jęz C/C++	EAIiE	4EBC	29	1	29	2	15	30	-	-	-	30																							30							
16	Pomiary technolog. i biomedyczne	EAIiE	5EZa	24	1	24	2	15	30	-	-	-	30													30E																	
17	Computer Methods of Identyfication	EAIiE	5ECEE	17	1	17	2	15	30	-	-	-	30		30E																												
18	Modelowanie i symulac. proc. pom.	EAIiE	5EZa	24	1	24	2	15	30	-	-	-	30												30																		
19	Metody numerycz w elektrotechnice	EAIiE	1 II st	108	1	108	-	-	-	2	10	20	20						20																								
20	Problem-oriented Laboratory	EAIiE	5ECEE	17	1	17	-	-	-			3	3		3																												
21	Środow proj syst pomiarowo-sterując	EAIiE	5RK	35	1	35	2	15	30	-	-	-	30											30																			
22	Pomiarowe metody identyfikacji	EAIiE	2St dok	5	1	5	-	-	-			30	30		30E																												
23	Modelow i integracja systemów pom	EAIiE	3St dok	10	1	10	-	-	-			30	30											30E																			
24	Podstawy elektroniki i miernictwa	GGiOŚ	2Inf.St	53	1	53	2	15	30	-	-	-	30					30E																									
25	Pomiary wielkości elektr. i nieelektr.	En i Pa	4	15	1	15	-	-	-	2	15	30	30									30E																					
26	Podstawy metrologii	MSzIB	2	140	1	140	2	15	30	-	-	-	30			30E																											
27	Sensory i pomiary wielkości nieelek.	MSzIB	2	70	1	70	-	-	-	2	15	30	30			30E																											
28	Zintegrowane czujniki pomiarowe	MSzIB	2	70	1	70	-	-	-	2	15	30	30			30E																											
29	Elektronika praktyczna	MSzIB	4	46	1	46	2	15	30	-	-	-	30			16														14													
30	Programowanie syst. kontrolno-pom.	MSzIB	4	22	1	22	2	15	30	-	-	-	30										30																				
31	Programow mikrokontr w jęz C/C++	MSzIB	3	46	1	46	-	-	-	2	15	30	30																							30							
32	Podstawy graficznych języków progr	MSzIB	3	120	1	120	2	15	30	-	-	-	30										30E																				
33	Syst elektron dla potrzeb aplik medy	MSzIB	1 IIst	30	1	30	-	-	-	2	15	30	30			30E																											
34	Projektowanie układów scalon VLSI	MSzIB	1 IIst	30	1	30	-	-	-	2	15	30	30			30																											
35	Zaawans met progr aplik wielowątk	MSzIB	1 IIst	16	1	16	-	-	-	2	15	30	30										30																				
36	Algor przetw i analizy obrazów med	MSzIB	2 IIst	39	1	39	2	15	30	-	-	-	30														30																
	SEMINARIUM																																										
1	Seminarium dyplomowe	EAIiE	5EZa	27	1	27	-	-	-	2	15	30	30		30																												
2	Seminarium dyplomowe	EAIiE	4EC	55	2	28	2	15	60	-	-	-	60				60																										

Stwierdzam prawidłowość ustalenia liczebności grup studenckich zgodnie z obowiązującymi przepisami
DZIEKAN WYDZIAŁU

Stwierdzam zgodność planu z programem studiów
KIEROWNIK KATEDRY

Pieczęć Katedry

SPRAWOZDANIE Z PLANU OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNEGO W ROKU 2010 / 2011

Lp	Przedmiot wg programu studiów	Wydział	Rok	Ilość studentów na roku	Ilość grup (wykł.ćwicz. lab)	Liczebność grupy	Semestr zimowy			Semestr letni			RAZEM godz. w ciągu roku	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe																												
							Wymiar tygodniowy	Ilość tygodni	Ogółem godzin	Wymiar tygodniowy	Ilość tygodni	Ogółem godzin		Bień Andrzej profesor	Gajda Janusz profesor	Gryboś Paweł profesor	Sidor Tadeusz profesor	Szyper Michał profesor	Borkowski Dariusz adiunkt	Burnos Piotr adiunkt	Duda Krzysztof adiunkt	Gawędzki Wacław adiunkt	Maj Piotr adiunkt	Nabielec Jerzy adiunkt	Nalepa Jacek adiunkt	Piwowar Piotr adiunkt	Skalski Andrzej adiunkt	Sroka Ryszard adiunkt	Stencel Marek adiunkt	Szczygieł Robert adiunkt	Turcza Paweł adiunkt	Wetula Andrzej adiunkt	Zatorski Andrzej adiunkt	Żegleń Tadeusz adiunkt	Żołądź Mirosław adiunkt	Kachel Maciej asystent	Kasiński Krzysztof asystent	Kmon Piotr asystent	Marszałek Zbigniew asyst.	Socha Mirosław asystent	Jurkiewicz Jerzy st. wykł.	Zalas Jacek st. wykład.	
	ĆWICZENIA LABORATORYJNE																																									
1	Metrologia	EAIiE	1K	222	18,5	12	-	-	-	2	15	555	555							28				55		28		55	112			55	139								83		
2	Podstawy informatyki I	EAIiE	1E	48	4	12	2	15	120	-	-	-	120						30												60	30											
3	Podstawy informatyki II	EAIiE	1E	48	4	12	-	-	-	2	15	120	120						40												30	50											
4	Metrologia I	EAIiE	2E	168	14	12	2	15	420	-	-	-	420							60				90																	180	90	
5	Metrologia II	EAIiE	2E	156	13	12	-	-	-	2	15	390	390							30	148					30														20		162	
6	Metrology	EAIiE	1M	24	2	12	-	-	-	2	15	60	60				30																	30									
7	Metrologia i systemy pomiarowe	EAIiE	2A	60	5	12	2	15	150	-	-	-	150																90										60				
8	Pomiary w energetyce	EAIiE	3EA	50	4,2	12	2	15	125	-	-	-	125						63													62											
9	Teoria i przetwarzanie sygnałów	EAIiE	3EB	30	2,5	12	2	15	75	-	-	-	75																		75												
10	Elektroniczne układy pomiarowe	EAIiE	3EC	48	4	12	-	-	-	1	15	60	60																	30				30									
11	Metody identyfikacji systemów	EAIiE	3EC	48	4	12	-	-	-	2	15	120	120							90						30																	
12	Miernictwo przemysłowe	EAIiE	3EC	48	4	12	-	-	-	2	15	120	120									60																		60			
13	Systemy pomiarowe	EAIiE	3EC	48	4	12	2	15	120	-	-	-	120													60		60															
14	Teoria i przetwarzanie sygnałów	EAIiE	3EC	48	4	12	2	15	120	-	-	-	120								120																						
15	Komputerowe systemy pomiarowe	EAIiE	3N	120	10	12	2	15	300	-	-	-	300									90			90		60													60			
16	Systemy pomiarowe	EAIiE	3R	120	10	12	-	-	-	2	15	300	300												84														56	70	90		
17	Programow mikrokontr w jęz C/C++	EAIiE	4EBC	29	2,4	12	2	15	72	-	-	-	72																						72							
18	Pomiary technolog. i biomedyczne	EAIiE	5EZa	24	2	12	2	15	60	-	-	-	60													30						30											
19	Computer Methods of Identyfication	EAIiE	5ECEE	17	1,4	12	2	15	42	-	-	-	42		14					28																							
20	Metody numerycz w elektrotechnice	EAIiE	1 II st	108	9	12	-	-	-	2	10	180	180						100													80											
21	Podstawy elektroniki i miernictwa	GGiOŚ	2Inf.St	53	5	11	3	15	225	-	-	-	225				45																	180									
22	Pomiary wielkości elektr. i nieelektr.	En i Pa	4	15	1	15	-	-	-	2	15	30	30									30																					
23	Podstawy metrologii	MSzIB	2	140	10	14	2	15	300	-	-	-	300																						30	150	120						
24	Sensory i pomiary wielkości nieelek.	MSzIB	2	140	10	14	-	-	-	2	15	300	300														90								60	90		60					
25	Elektronika praktyczna	MSzIB	4	46	3	15	2	15	90	-	-	-	90																	90													
26	Programowanie syst. kontrolno-pom.	MSzIB	4	22	2	11	2	15	60	-	-	-	60										60																				
27	Programow mikrokontr w jęz C/C++	MSzIB	3	46	3	15	-	-	-	2	15	90	90																						90								
28	Podstawy graficznych języków progr	MSzIB	3	120	8	15	2	15	30	-	-	-	240										60															180					
29	Syst elektron dla potrzeb aplik medy	MSzIB	1 IIst	30	2	15	-	-	-	1	15	30	30																								30						
30	Projektowanie układów scalon VLSI	MSzIB	1 IIst	30	2	15	-	-	-	2	15	60	60																								60						
31	Zaawans met progr aplik wielowątk	MSzIB	1 IIst	16	1	16	-	-	-	2	15	30	30										30																				
32	Algor przetw i analizy obrazów med	MSzIB	2 IIst	39	3	13	2	15	90	-	-	-	90														60													30			
	PROJEKTY																																										
1	Elektroniczne układy pomiarowe	EAIiE	3EC	48	2,4	20	-	-	-	1	15	36	36																	18				18									
2	Metody identyfikacji systemów	EAIiE	3EC	48	2,4	20	-	-	-	1	15	36	36							27						9																	
3	Systemy pomiarowe	EAIiE	3EC	48	2,4	20	1	15	36	-	-	-	36													18		18															
4	Teoria i przetwarzanie sygnałów	EAIiE	3EC	48	2,4	20	1	15	36	-	-	-	36								36																						
5	Modelowanie i symulac. proc. pom.	EAIiE	5EZa	24	1,2	20	2	15	36	-	-	-	36												36																		
6	Syst elektron dla potrzeb aplik medy	MszIB	1 IIst	31	1	31	-	-	-	1	15	15	15																								6	9				

Stwierdzam prawidłowość ustalenia liczebności grup
studenckich zgodnie z obowiązującymi przepisami
DZIEKAN WYDZIAŁU

Pieczęć Katedry

SPRAWOZDANIE Z PLANU OBCIĄŻENIA DYDAKTYCZNEGO W ROKU 2010 / 2011

STUDIA NIESTACJONARNE

Lp	Przedmiot wg programu studiów	Wydział	Rok	Ilość studentów na roku	Ilość grup (wykł. ćwicz lab)	Liczebność grupy	Semestr zimowy			Semestr letni			RAZEM godz. w ciągu roku	Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe																												
							Ilość tygodni	Wymiar tygodniowy	Ogółem godzin	Ilość tygodni	Wymiar tygodniowy	Ogółem godzin		Bień Andrzej profesor	Gajda Janusz profesor	Gryboś Paweł profesor	Sidor Tadeusz profesor	Szyper Michał profesor	Borkowski Dariusz adiunkt	Burnos Piotr adiunkt	Duda Krzysztof adiunkt	Gawędzki Wacław adiunkt	Maj Piotr adiunkt	Nabielec Jerzy adiunkt	Nalepa Jacek adiunkt	Piwowar Piotr adiunkt	Skalski Andrzej adiunkt	Sroka Ryszard adiunkt	Stencel Marek adiunkt	Szczygieł Robert adiunkt	Turcza Paweł adiunkt	Wetula Andrzej adiunkt	Zatorski Andrzej adiunkt	Żegleń Tadeusz adiunkt	Żołądź Mirosław adiunkt	Kachel Maciej asystent	Kasiński Krzysztof asyst.	Kmon Piotr asystent	Marszałek Zbigniew asyst.	Socha Mirosław asystent	Jurkiewicz Jerzy st. wykł.	Zalas Jacek st. wykład.	
	WYKŁADY																																									
1	Pomiary wielkości nieelektrycznych	EAIiE	1 EE	48	1	48	-	-	-			15	15									15E																				
2	Algorytmy przetwarzania sygnałów	EAIiE	1 EAu	11	1	11	-	-	-			18	18																		18E											
3	Pomiarowe układy elektroniczne	EAIiE	1 EAu	11	1	11			18	-	-	-	18																					18								
4	Pomiary wielkości nieelektrycznych	EAIiE	1 EAu	11	1	11	-	-	-				16									16E																				
5	Metrologia I	EAIiE	2 E	30	1	30	-	-	-			27	27															27														
6	Metrologia	EAIiE	2 K	24	1	24			21	-	-	-	21																												21E		
7	Podstawy metrologii	EAIiE	2 RKS	23	1	23	-	-	-			24	24																												24E		
8	Metrologia II	EAIiE	3 E	36	1	36			18	-	-	-	18															18E															
	ĆWICZ. LABORATORYJNE																																									
1	Pomiary wielkości nieelektrycznych	EAIiE	1 EE	48	4	12	-	-	-			60	60														30												30			
2	Algorytmy przetwarzania sygnałów	EAIiE	1 EAu	11	1	11	-	-	-			18	18																		18											
3	Pomiarowe układy elektroniczne	EAIiE	1 EAu	11	1	11			18	-	-	-	18																					18								
4	Pomiary wielkości nieelektrycznych	EAIiE	1 EAu	11	1	11	-	-	-			24	24									24																				
5	Metrologia	EAIiE	2 K	24	2	12			24	-	-	-	24																												24		
6	Podstawy metrologii	EAIiE	2 RKS	23	2	12	-	-	-			32	32																					16							16		
7	Metrologia II	EAIiE	3 E	36	3	12			81	-	-	-	81															54	27														

Stwierdzam prawidłowość ustalenia liczebności grup studenckich zgodnie z obowiązującymi przepisami
DZIEKAN WYDZIAŁU

Stwierdzam zgodność planu z programem studiów
KIEROWNIK KATEDRY

Pieczęć Katedry

PLAN ZATRUDNIENIA NA ROK 2008 / 09

STUDIA STACJONARNE

Lp	Przedmiot wg programu studiów	Wydział	Rok	Ilość studentów na roku	Ilość grup (wykł.ćwicz. lab)	Liczebność grupy	Semestr zimowy			Semestr Letni			RAZEM godz. w ciągu roku	Gajda Janusz profesor	Gryboś Paweł profesor	Sidor Tadeusz profesor	Szyper Michał profesor	Bień Andrzej adiunkt	Borkowski Dariusz adiunkt	Duda Krzysztof adiunkt	Gawędzki Wacław adiunkt	Jurkiewicz Jerzy adiunkt											Miękus Artur doktorant	Boroń Piotr doktorant	Kasiński Krzyszt doktorant	Kowalski Jakub doktorant	Kłeczek Rafał doktorant	Marszałek Zbigniew doktor.	Mielczarek Michał doktor.	Nowik Mateusz doktorant	Otfinowski Michał doktor.	Papierz Konrad doktorant	Rzeszutko Jakub doktorant
	ĆWICZENIA LABORATORYJNE						Wymiar tygodniowy	Ilość tygodni	Ogółem godzin	Ilość tygodni	Wymiar tygodniowy	Ogółem godzin																															
1	Metrologia	EAIiE	1K																																								
2	Podstawy informatyki I	EAIiE	1E																																								
3	Podstawy informatyki II	EAIiE	1E																																								
4	Metrologia I	EAIiE	2E																																								
5	Metrologia II	EAIiE	2E																																								
6	Metrology	EAIiE	1M																																								
7	Metrologia i systemy pomiarowe	EAIiE	2A																																	60							
8	Pomiary w energetyce	EAIiE	3EA																																*30*			*30*		*30*		
9	Teoria i przetwarzanie sygnałów	EAIiE	3EB																																								
10	Elektroniczne układy pomiarowe	EAIiE	3EC																																		*15*						
11	Metody identyfikacji systemów	EAIiE	3EC																																				*30*				
12	Miernictwo przemysłowe	EAIiE	3EC																																								
13	Systemy pomiarowe	EAIiE	3EC																														*30*										
14	Teoria i przetwarzanie sygnałów	EAIiE	3EC																																								
15	Komputerowe systemy pomiarowe	EAIiE	3N																																								
16	Systemy pomiarowe	EAIiE	3R																																	56							
17	Programow mikrokontr w jęz C/C++	EAIiE	4EBC																																								
18	Pomiary technolog. i biomedyczne	EAIiE	5EZa																															*30*									*30*
19	Computer Methods of Identyfication	EAIiE	5ECEE																																								
20	Metody numerycz w elektrotechnice	EAIiE	1 II st																																								
21	Podstawy elektroniki i miernictwa	GGiOŚ	2Inf.St																																								
22	Pomiary wielkości elektr. i nieelektr.	En i Pa	4																																								
23	Podstawy metrologii	MSzIB	2																																120								
24	Sensory i pomiary wielkości nieelek.	MSzIB	2																																								
25	Elektronika praktyczna	MSzIB	4																																		*15*						
26	Programowanie syst. kontrolno-pom.	MSzIB	4																																					*30*			
27	Programow mikrokontr w jęz C/C++	MSzIB	3																																								
28	Podstawy graficznych języków progr	MSzIB	3																																								
29	Syst elektron dla potrzeb aplik medy	MSzIB	1 IIst																																30								
30	Projektowanie układów scalon VLSI	MSzIB	1 IIst																																60								
31	Zaawans met progr aplik wielowątk	MSzIB	1 IIst																																								
32	Algor przetw i analizy obrazów med	MSzIB	2 IIst																																								
33																																											
34																																											
35																																											
36																																											
	PROJEKTY																																										
1	Elektroniczne układy pomiarowe	EAIiE	3EC																																								
2	Metody identyfikacji systemów	EAIiE	3EC																																								
3	Systemy pomiarowe	EAIiE	3EC																																								
4	Teoria i przetwarzanie sygnałów	EAIiE	3EC																																								
5	Modelowanie i symulac. proc. pom.	EAIiE	5EZa																																								
6	Syst elektron dla potrzeb aplik medy	MSzIB	1 IIst																																6								

Stwierdzam prawidłowość ustalenia liczebności grup studenckich zgodnie z obowiązującymi przepisami
DZIEKAN WYDZIAŁU

Stwierdzam zgodność planu z programem studiów
KIEROWNIK KATEDRY